

02 июня

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

- 10.30-10.45 **К.И. Таперо** – *Председатель Программного комитета АО «НИИП»*
- Н.Н. Давиденко** – *Заместитель генерального директора – директор по технологическому развитию АО «ВНИИАЭС»*
- А.В. Яненко** – *Зам. председателя Программного комитета АО «ЭНПО СПЭЛС»*

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

- 10.45-11.00 **Г.А. Протопопов, П.А. Чубунов**
АО «НИИ КП»
Формирование модели ВВФ ИИ КП на ЭКБ из состава бортовой аппаратуры
- 11.00-11.15 **Н.М. Хамидуллина¹, М.Е. Артемов¹, Т.Ш. Комбаев², Е.В. Власенков², И.В. Зефилов¹**
¹АО «НПО Лавочкина», ²Филиал АО «НПО Лавочкина»
Радиационная обстановка на трассе полета перспективного космического аппарата для исследования Юпитера и его спутников
- 11.15-11.30 **П.Р. Гильванов, А.Е. Козюков, М.В. Кожухов**
ООО «Прогноз-РС»
Сравнение результатов расчетов поглощенной дозы в бортовой аппаратуре методом Монте-Карло и методом секторного анализа
- 11.30-11.45 **П.Я. Кундышев^{1,2}, В.И. Бутин^{1,2}**
¹ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ²НИЯУ МИФИ
Влияние воздействия поляризованного микроволнового излучения на проникновение электромагнитного поля внутрь экранирующего корпуса

11.45-12.00 **ОБЗОР ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ**

12.00-12.45 **Кофе-брейк**

12.45-13.15 **ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ**

5. 13.15-13.30 **А.И. Чумаков^{1,2}, Д.В. Бобровский^{1,2}, А.А. Смолин³**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³Независимый исследователь
 Особенности оценки параметров чувствительности ИС по одиночным радиационным эффектам при воздействии ионов с энергиями выше 100 МэВ/нуклон
6. 13.30-13.45 **А.В. Яненко^{1,2}, А.Е. Козюков^{2,3}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³ООО «Прогноз-РС»
 Испытания ЭКБ в составе блоков аппаратуры на стойкость по одиночным эффектам на ускорителях протонов. Тенденции и технические возможности
7. 13.45-14.00 **П.В. Рубанов¹, А.С. Ватуев¹, В.В. Емельянов¹, А.А. Шарапов¹, С.В. Митрофанов², А.Т. Исатов²**
¹АО «НИИП», ²ЛЯР им. Г.Н. Флерова ОИЯИ
 Ионная испытательная станция АО «НИИП»
8. 14.00-14.15 **А.С. Бакеренков, П.А. Чубунов, В.А. Фелицын, В.В. Юдин, Г.В. Стародубцов, Е.М. Мельник, О.А. Тверитнева**
 АО «НИИ КП»
 Комплекс оборудования испытательной камеры для бустерного вывода синхротронного комплекса испытаний

14.15-15.15 **Кофе-брейк**

9. 15.15-15.30 **Е.В. Мрозовская^{1,2}, О.И. Ровняков¹, А.В. Семенов¹, Г.И. Зебрев²**
¹ИКИ РАН, ²НИЯУ МИФИ
Применение адаптированного метода структурного анализа для оценки сбоеустойчивости к ОРЭ
10. 15.30-15.45 **Г.И. Зебрев, А.А. Матейко, ГА. Машенцев**
НИЯУ МИФИ
Оценка частоты логических сбоев от одиночных ионов при наличии систем коррекции ошибок и для разных топологий ячеек памяти
11. 15.45-16.00 **А.С. Пилипенко, М.И. Тихонов**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Множественные сбои в СОЗУ МК, возникающие при воздействии нейтронного излучения
12. 16.00-16.15 **А.А. Шарапов, А.В. Сиделев, А.С. Ватуев, К.И. Таперо**
АО «НИИП»
Исследование откликов пиксельных детекторов на воздействие сфокусированного лазерного излучения
13. 16.15-16.30 **А.Б. Боруздина^{1,2}, А.В. Яненко^{1,2}, А.Р. Мустафин^{1,2}, Д.В. Котова^{1,2}, А.С. Тарараксин^{1,2}, И.О. Лоскутов^{1,2}, В.Г. Напалков^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Особенности испытаний многокристалльных модулей на стойкость к одиночным радиационным эффектам

03 июня

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

14. 10.30-10.45 **И.А. Бусыгина, Р.С. Плишко, В.А. Рахимова, Н.В. Юрков**
АО «НИИП»
Актуальная база средств измерений и эталонов характеристик ионизирующих излучений
15. 10.45-11.00 **Е.О. Моргачев, Г.А. Протопопов, М.В. Яковлев**
АО «ЦНИИмаш»
Актуализация нормативно-технической базы в части обеспечения радиационной стойкости бортовой аппаратуры
16. 11.00-11.15 **П.А. Чубунов, Д.Г. Крылов, И.В. Скоркин**
АО «НИИ КП»
Особенности оценки соответствия ЭКБ для космической техники требованиям по стойкости к воздействию ИИ КП
17. 11.15-11.30 **И.А. Тужикова, Г.А. Протопопов, К.Д. Задорожный, П.А. Чубунов, Д.Н. Задорожко**
АО «НИИ КП»
Практическое применение баз данных радиационных испытаний для аналитической оценки стойкости аппаратуры
18. 11.30-11.45 **А.Е. Козюков**
ООО «Прогноз-РС»
Особенности проведения оценки радиационной стойкости расчётно-аналитическим методом

11.45-12.45 Кофе-брейк

19. 12.45-13.00 **В.А. Разаев¹, А.Н. Ивонин²**
¹МОКБ «Марс» - филиал ФГУП «ВНИИА»,
²ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
 Особенности проектирования бортового вычислителя с повышенной отказоустойчивостью к радиационному воздействию
20. 13.00-13.15 **А.В. Назаров, Ю.А. Кабальнов, В.Н. Иконников**
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Вопросы разработки радиофотонного передающего тракта на отечественной элементной базе
21. 13.15-13.30 **В.Д. Калашников^{1,2}, С.Ю. Дианков³, А.В. Согоян^{1,2},
 А.В. Уланова^{1,2}, Д.В. Бойченко^{1,2}, Г.Г. Давыдов^{1,2},
 А.Г. Петров²**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³Независимый исследователь
 Статистический разброс показателей стойкости типовых изделий электронной компонентной базы к воздействию импульсного ионизирующего излучения
22. 13.30-13.50 **А.В. Бутин¹, В.И. Бутин^{1,2}**
¹ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ²НИЯУ МИФИ
 Расчётно-экспериментальная методика оценки сбоеустойчивости полупроводниковых приборов при воздействии импульсных ионизирующих излучений с использованием макропараметров диффузионно-дрейфовой модели диодных структур
23. 13.50-14.10 **А.В. Согоян^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Локальные модели прогнозирования уровней отказов слабо-нелинейных систем
- 14.10-15.10 **Кофе-брейк**

24. 15.10-15.30 **А.Л. Кривенков¹, Д. Сашников¹, А.И. Жуков², Д.А. Бураев², А.С. Родин², Г.И. Зебрев²**
¹АО «Арсенал» КрЗПП», ²НИЯУ МИФИ
Экспериментальное исследование влияния эффектов дозы на вольтамперные характеристики мощных SiC МОП-транзисторов при разных температурах
25. 15.30-15.45 **О.В. Ткачёв, А.С. Кустов, Е.А. Шibaков, С.М. Дубровских, Д.В. Букин, А.Г. Березовский, И.Н. Ипполитов, В.С. Носовец, А.С. Пилипенко**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Влияние ионизационных дозовых эффектов на метрологические характеристики полупроводниковых детекторов
26. 15.45-16.00 **Д.М. Бакеренкова**
АО «НИИП»
Экспериментальное моделирование влияния радиационных нагрузок на стойкость мощных МОП-транзисторов к воздействию электростатических разрядов

16.00-16.15 **Дискуссия. Предложения в Решение конференции**

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

- C1 **Е.В. Власенков, Н.М. Хамидуллина, И.В. Зефиров**
АО «НПО Лавочкина»
Оценка воздействия бортовых радиоизотопных источников на организм космонавта при управлении перспективным тяжелым луноходом на поверхности луны
- C2 **М.В. Анохин, В.И. Галкин, А.К. Малков**
СКБ КП ИКИ РАН
Экспресс-оценка вероятности частоты сбоев SEE на космических аппаратах с использованием спектра плотности электрического заряда в треках ионизирующих частиц
- C3 **В.Ф. Зинченко**
АО «Российские космические системы»
Особенности оценки стойкости микросхем флэш памяти к эффектам одиночных событий по результатам испытаний в пучках ионов
- C4 **А.В. Назаров, Ю.А. Кабальнов, В.Н. Иконников**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Вопросы разработки радиофотонного передающего тракта на отечественной элементной базе
- C5 **А.В. Скупов**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Схемотехнические модели дискретных полупроводниковых приборов для моделирования радиационных эффектов в РЭА
- C6 **Н.М. Хамидуллина¹, М.Е. Артемов¹, Т.Ш. Комбаев², Е.В. Власенков², И.В. Зефиров¹**
¹АО «НПО Лавочкина», ²Филиал АО «НПО Лавочкина»
Радиационная обстановка на трассе полета перспективного космического аппарата для исследования Юпитера и его спутников
- C7 **В.В. Бибикова, И.Ю. Забавичев, С.В. Оболенский, А.А. Потехин, А.А. Пузанов**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Особенности оценки сбоеустойчивости субмикронных интегральных схем при лазерном моделировании воздействия ТЗЧ: влияние длительности импульса и площади облучения

- С8 В.В. Бибикова, И.Ю. Забавичев, С.В. Оболенский, А.А. Потехин, А.А. Пузанов**
Сравнение методов аппроксимации сечений одиночных сбоев микросхем статической памяти 4 и 8 Мбит по данным лазерного облучения
- С9 Е.О. Моргачев, Г.А. Протопопов, М.В. Яковлев**
АО «ЦНИИмаш»
Актуализация нормативно-технической базы в части обеспечения радиационной стойкости бортовой аппаратуры
- С10 И.С. Гвоздев, Г.А. Протопопов**
АО «ЦНИИмаш»
Оценка эффективности адаптивного управления скраббингом микросхем памяти
- С11 Е.В. Мрозовская^{1,2}, О.И. Ровняков¹, А.В. Семенов¹, Г.И. Зебрев²**
¹ИКИ РАН, ²НИЯУ МИФИ
Применение адаптированного метода структурного анализа для оценки сбоеустойчивости к ОРЭ
- С12 П.Р. Гильванов, А.Е. Козюков, М.В. Кожухов**
ООО «Прогноз-РС»
Сравнение результатов расчетов поглощенной дозы в бортовой аппаратуре методом Монте-Карло и методом секторного анализа
- С13 А.С. Яковлев^{1,2}**
¹АО «Российские космические системы», ²НИЯУ МИФИ
Оценка спектра высокоэнергетических протонов космического пространства за некоторыми многослойными экранами
- С14 Г.И. Зебрев, А.А. Матейко, Г.А. Машенцев**
НИЯУ МИФИ
Оценка частоты логических сбоев от одиночных ионов при наличии систем коррекции ошибок и для разных топологий ячеек памяти
- С15 А.Л. Кривенков¹, Д. Сашников¹, А.И. Жуков², Д.А. Буреав², А.С. Родин², Г.И. Зебрев²**
¹АО «Арсенал» КрЗПП, ²НИЯУ МИФИ
Экспериментальное исследование влияния эффектов дозы на вольтамперные характеристики мощных SiC МОП-транзисторов при разных температурах
- С16 Д.О. Селихов**
НИ ТПУ
Разработка портативного аппаратно-программного устройства для работы с полупроводниковыми детекторами ионизирующего излучения

- С17 А.А. Коновалов¹, С.М. Дубровских¹, О.В. Ткачёв¹, Ю.О. Шаронова², И.С. Азанова², Д.В. Хисамов²**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ²ПАО «ПНППК»
Влияние температуры на радиационную чувствительность оптических волокон
- С18 О.В. Ткачёв^{1,2}, М.С. Иванова^{1,2}, М.Г. Березовская¹**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ²СФТИ НИЯУ МИФИ
Монитор СЖРИ при проведении радиационных испытаний
- С19 Д.Ю. Казанцев^{1,2}, А.С. Пилипенко¹, Ю.В. Осеев¹**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ²СФТИ НИЯУ МИФИ
Одинокые радиационные эффекты, возникающие в операционных усилителях при облучении нейтронами спектра деления
- С20 А.А. Коновалов¹, С.М. Дубровских¹, О.В. Ткачёв¹, Ю.О. Шаронова², И.С. Азанова², Д.В. Хисамов²**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ²ПАО «ПНППК»
Особенности фотостимулированного отжига оптических волокон при воздействии импульсного ионизирующего излучения
- С21 А.С. Кустов, О.В. Ткачёв, А.С. Аверьякин, А.В. Кустова, О.А. Мингазов, А.А. Ступаков**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Микросхемы СОЗУ как детектор нейтронов на исследовательских ядерных реакторах
- С22 В.С. Носовец^{1,2}, О.В. Ткачев¹**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ²УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина
Влияние ионизирующего излучения на фотогальванический эффект в гетероструктурах с квантовыми ямами на основе $A^{III}B^V$
- С23 А.С. Пилипенко¹, Л.С. Зубков²**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ²НИЯУ МИФИ
Оценка равномерности распределения сбоев в СОЗУ
- С24 А.С. Пилипенко, М.И. Тихонов**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Множественные сбои в СОЗУ МК, возникающие при воздействии нейтронного излучения

- С25 И.Д. Приходько^{1,2}, В.С. Носовец^{1,3}**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ²Челябинский государственный университет, ³УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина
Реакция квантоворазмерных светоизлучающих гетероструктур на импульс электронов
- С26 О.В. Ткачев, А.А. Ступаков, А.С. Кустов**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Локальные структурные повреждения в микросхемах ДОЗУ
- С27 О.В. Ткачёв, А.С. Кустов, Е.А. Шibaков, С.М. Дубровских, Д.В. Букин, А.Г. Березовский, И.Н. Ипполитов, В.С. Носовец**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Влияние ионизационных дозовых эффектов на метрологические характеристики полупроводниковых детекторов
- С28 Д.М. Бакеренкова, А.С. Петров**
АО «НИИП»
Экспериментальное моделирование влияния гамма-облучения на стойкость мощных МОП-транзисторов к воздействию электростатических разрядов
- С29 Д.М. Бакеренкова, А.С. Петров**
АО «НИИП»
Исследование влияния нейтронного облучения на стойкость мощных МОП-транзисторов к воздействию электростатических разрядов
- С30 А.Э. Земцов^{1,2}, К.И. Таперо^{1,2}, В.В. Емельянов¹, А.С. Петров¹, А.В. Бесецкий¹**
¹АО «НИИП», ²НИТУ МИСИС
Оценка величины выхода заряда в подзатворном оксиде МОП-структур при воздействии импульсного ионизирующего излучения с различными значениями дозы за импульс
- С31 А.Э. Земцов^{1,2}, К.И. Таперо^{1,2}, В.В. Емельянов¹, А.С. Петров¹, А.В. Бесецкий¹**
¹АО «НИИП», ²НИТУ МИСИС
Динамика восстановления порогового напряжения МОП-транзисторов после воздействия импульса ионизирующего излучения при различных условиях облучения

- С32 В.В. Емельянов, А.С. Петров, М.А. Тюрников, Р.Г. Усеинов**
АО «НИИП»
Особенности интерпретации типов ошибок в СОЗУ при воздействии отдельных ядерных частиц
- С33 А.А. Шарاپов^{1,2}, А.В. Сиделев¹, А.С. Ватуев¹, К.И. Таперо^{1,2}**
¹АО «НИИП», ²НИТУ МИСИС
Исследование электрических характеристик образцов пиксельных чувствительных матриц
- С34 А.А. Шарاپов^{1,2}, А.В. Сиделев¹, А.С. Ватуев¹, К.И. Таперо^{1,2}**
¹АО «НИИП», ²НИТУ МИСИС
Особенности применения сфокусированного лазерного излучения при испытаниях низкоразмерных структур
- С35 А.А. Шарاپов^{1,2}, А.В. Сиделев¹, А.С. Ватуев¹, К.И. Таперо^{1,2}**
¹АО «НИИП», ²НИТУ МИСИС
Исследование структуры пиксельных матриц с использованием сфокусированного лазерного излучения в режиме двухфотонного поглощения
- С36 А.А. Шарاپов^{1,2}, А.В. Сиделев¹, А.С. Ватуев¹, К.И. Таперо^{1,2}**
¹АО «НИИП», ²НИТУ МИСИС
Исследование чувствительности пиксельных детекторов к сфокусированному лазерному излучению при однофотонном поглощении в кремнии
- С37 П.В. Рубанов¹, А.С. Ватуев¹, В.В. Емельянов¹, А.А. Шарاپов¹, С.В. Митрофанов², А.Т. Исатов²**
¹АО «НИИП», ²ЛЯР им. Г.Н. Флерова ОИЯИ
Ионная испытательная станция АО «НИИП»
- С38 Р.Г. Усеинов, А.А. Шарاپов**
АО «НИИП»
Расчет ЛПЭ-спектров вторичных ионов, возникающих при взаимодействии нейтронов с ядрами ^{NAT}W в слоях металлизации современных интегральных схем
- С39 О.В. Мещуров, Р.Г. Усеинов**
АО «НИИП»
Влияние температуры окружающей среды на параметры МОП-детектора поглощенной дозы в процессе низкоинтенсивного облучения
- С40 И.А. Бусыгина, Р.С. Плишко, В.А. Рахимова, Н.В. Юрков**
АО «НИИП»
Актуальная база средств измерений и эталонов характеристик ионизирующих излучений и ее дальнейшее развитие

- C41 **И.А. Бусыгина, Р.С. Плишко, В.А. Рахимова, Н.В. Юрков**
АО «НИИП»
Расчетно-экспериментальная оценка коэффициента ослабления гамма-излучения для различных материалов
- C42 **И.А. Бусыгина, Р.С. Плишко, Г.Х. Салахутдинов**
АО «НИИП»
Регистрация нейтронного излучения с применением термолюминесцентных детекторов
- C43 **Д.М. Иващенко, Ю.С. Лойко, Д.Ю. Савинов, А.В. Кириллов**
АО «НИИП»
Оптимизация процесса сбора и анализа данных системы диагностики установки УИН-10
- C44 **А.Б. Гирко, Е.В. Тулисов, Т.Б. Мавлюдов, И.В. Медведев, И.А. Бусыгина, В.А. Рахимова, И.А. Алексеев**
АО «НИИП»
Формирование длительности импульса тормозного излучения системой синхронизации ускорителя ЛИУ-10
- C45 **С.В. Белоусов, А.И. Кононенко, Р.В. Слабоус, Е.А. Тевризова**
АО «НИИП»
Влияние эксплуатационного старения кабельной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата на стойкость к повреждающим факторам проектных аварий на АЭС
- C46 **Р.В. Слабоус, А.И. Кононенко**
АО «НИИП»
О возможности неразрушающего контроля состояния резинотехнических материалов, применяемых при изготовлении изделий для атомных станций
- C47 **А.А. Балухев^{1,2}, В.П. Лукашин^{1,2}, Р.К. Можжев^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Влияние наличия электрического смещения полупроводниковых светоизлучающих структур на основе AlInGaP, InGaN и GaAs на их радиационную стойкость к эффектам поглощенной дозы при воздействии электронами
- C48 **К.А. Епифанцев^{1,2}, А.Н. Шемонаев^{1,2}, А.А. Аникин^{1,2}, М.В. Литвинова^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Режимы работы электронных компонентов при проведении экспериментальной оценки показателей стойкости к воздействию импульсов напряжения

- C49 **А.Г. Петров^{1,2}, И.И. Швецов-Шиловский^{1,2}, С.Б. Шамаков^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Сравнение поведения КМОП СОЗУ при стационарном и импульсном наборе дозы
- C50 **А.Н. Шемонаев^{1,2}, В.П. Лукашин², А.А. Балувев², Р.К. Можяев²**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Экспериментальная оценка уровней порогов деградации в светодиодах видимого спектра при воздействии последовательности импульсов напряжения
- C51 **А.В. Согоян^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Локальные линейные модели импульсной реакции систем со «слабой» нелинейностью
- C52 **А.В. Согоян^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методы учета характеристик импульсного излучения в нелинейных системах Винера и Гаммерштейна
- C53 **А.В. Согоян^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Влияние геометрических и нелинейных эффектов на вид РГХ тиристорного эффекта в КМОП ИС
- C54 **С.Б. Шамаков^{1,2}, М.С. Бердо^{1,2}, И.И. Швецов-Шиловский^{1,2}, А.Г. Петров^{1,2}, А.В. Яненко^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методические особенности контроля одиночных сбоев при воздействии ТЗЧ в твердотельных накопителях с включенной системой коррекции
- C55 **М.А. Шульгин^{1,2}, Н.А. Усачев^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Разработка методики восстановления параметров модели GaN HEMT транзистора
- C56 **А.И. Чумаков^{1,2}, Д.В. Бобровский^{1,2}, А.А. Смолин³, Е.М. Сыресин⁴, А.А. Сливин⁴, Г.А. Филатов⁴**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
Оценки значений линейных потерь высокоэнергетических ионов на стенде «ИСКРА» при разной толщине дегрейдера

- С57 А.В. Яненко^{1,2}, А.Е. Козюков^{2,3}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³ООО «Прогноз-РС»
 Испытания ЭКБ в составе блоков аппаратуры на стойкость по одиночным эффектам на ускорителях протонов. Тенденции и технические возможности
- С58 В.Д. Калашников^{1,2}, С.Ю. Дианков³, А.В. Сокоян^{1,2}, А.В. Уланова^{1,2}, Д.В. Бойченко^{1,2}, Г.Г. Давыдов^{1,2}, А.Г. Петров²**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³независимый исследователь
 Статистический разброс показателей стойкости типовых изделий электронной компонентной базы к воздействию импульсного ионизирующего излучения
- С59 А.Б. Боруздина^{1,2}, А.В. Яненко^{1,2}, А.Р. Мустафин^{1,2}, Д.В. Котова^{1,2}, А.С. Тарараксин^{1,2}, И.О. Лоскутов^{1,2}, В.Г. Напалков^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Особенности испытаний многокристалльных модулей на стойкость к одиночным радиационным эффектам
- С60 А.Н. Егоров^{1,2}, О.Б. Маврицкий^{1,2}, А.И. Чумаков^{1,2}, А.А. Печенкин^{1,2}, М.С.Холина¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Генерация импульсов произвольной формы на лазерном стенде МИКРО-1
- С61 М.К. Тимошкин^{1,2}, Н.А. Усачев^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Разработка инструментального усилителя мощности L-диапазона на основе GaN НЕМТ транзистора
- С62 П.А. Чубунов, Д.Г. Крылов, И.В. Скоркин**
 АО «НИИ КП»
 Особенности оценки соответствия ЭКБ для космической техники требованиям по стойкости к воздействию ИИ КП
- С63 Г.А. Протопопов, П.А. Чубунов**
 АО «НИИ КП»
 Формирование модели ВВФ ИИ КП на ЭКБ из состава бортовой аппаратуры
- С64 А.С. Бакеренков¹, П.А. Чубунов¹, В.А. Фелицын¹, В.В. Юдин¹, Г.В. Стародубцов¹, Е.М. Мельник¹, О.А. Тверитнева¹, Е.Н. Крылевский², А.Е. Здарьев², Ф.К. Киселев², А.В. Тельнов², С.В. Фильчагин²**
¹АО «НИИ КП», ²ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Испытательная камера для бустерного вывода синхротронного комплекса испытаний

- С65 А.С. Бакеренков¹, П.А. Чубунов¹, В.А. Фелицын¹, В.В. Юдин¹, Г.В. Стародубцов¹, Е.М. Мельник¹, О.А. Тверитнева¹, Е.Н. Крылевский², Ф.К. Киселев², Э.Н. Братишка², А.Е. Здарьев², С.В. Фильчагин²**
¹АО «НИИ КП», ²ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Автоматизированная система управления оборудованием испытательной камеры для бустерного вывода синхротронного комплекса испытаний
- С66 П.А. Чубунов¹, А.С. Бакеренков¹, В.В. Юдин¹, Г.В. Стародубцов¹, С.В. Митрофанов², А.Т. Исатов², Е.Н. Крылевский³, А.А. Малышев³, Т.А. Полётова³, А.В. Тельнов³**
¹АО «НИИ КП», ²ОИЯИ, ³ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Комплекс контроля характеристик тяжелых ионов для бустерного вывода синхротронного комплекса испытаний
- С67 П.А. Чубунов¹, С.В. Косьяненко², Е.Н. Крылевский³, Т.А. Полётова³, А.В. Тельнов³**
¹АО «НИИ КП», ²РаДиаТех, ³ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Комплекс контроля характеристик протонов для бустерного вывода синхротронного комплекса испытаний
- С68 А.И. Цветков, В.В. Лыков, Б.К. Шамсутдинов, Е.А. Фатькин, П.А. Чубунов**
 АО «НИИ КП»
 Анализ вариантов уточнения результатов испытаний за счет облучения ионом с малыми линейными потерями энергии
- С69 Б.К. Шамсутдинов, Е.А. Фатькин, А.И. Цветков, В.В. Лыков**
 АО «НИИ КП»
 Методические рекомендации по испытаниям ПЛИС на воздействие ионизирующих излучений космического пространства
- С70 Е.А. Фатькин, Т.С. Наполова, Б.К. Шамсутдинов, А.И. Цветков, В.В. Лыков, О.И. Галевко**
 АО «НИИ КП»
 Алгоритм проведения и обобщенные результаты испытаний приемопередатчиков при воздействии тяжелых заряженных частиц космического пространства
- С71 О.И. Галевко, В.А. Фелицын, Е.А. Фатькин, М.С. Мальцева, Н.А. Вавичкин, М.С. Кузнецов, П.А. Чубунов**
 АО «НИИ КП»
 Исследование механизмов катастрофических отказов в операционных усилителях на биполярных транзисторах при воздействии тяжелых заряженных частиц

- С72 Н.А. Вавичкин, В.В. Гасымов, М.С. Мальцева, М.С. Кузнецов, К.С. Осипов, В.А. Мажаров, Т.В. Никольская**
АО «НИИ КП»
Влияние способа декорпусирования на электрические параметры ЭКБ при подготовке к проведению испытаний
- С73 И.А. Тужикова, В.С. Миркина, Г.А. Протопопов, П.А. Чубунов, И.В. Скоркин, Д.Н. Задорожко**
АО «НИИ КП»
Практическое применение баз данных результатов испытаний для аналитической оценки стойкости аппаратуры
- С74 Г.В. Стародубцов**
АО «НИИ КП»
Оптимизация расчета дегрейдеров для испытания на воздействие ТЗЧ с применением программного комплекса SRIM
- С75 Е.М. Мельник, О.А. Тверитнева, А.С. Бакеренков, П.А. Чубунов, Е.А. Фатькин**
АО «НИИ КП»
Разработка автоматизированной системы вакуумирования для стенда испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ
- С76 В.В. Юдин**
АО «НИИ КП»
Устройство задания температурных режимов объектов радиационных испытаний на базе термозлектрических модулей
- С77 К.Н. Орлова¹, А.В. Градобоев², А.В. Беклемишева¹, Д.Н. Задорожко³**
¹НИЯУ МИФИ, ²НИ ТПУ, ³АО «НИИ КП»
Влияние гамма-квантов на омическое сопротивление светодиодов на основе AlGaInP ($\lambda = 590$ нм)
- С78 С.А. Лазарев¹, Е.С. Михайлов¹, С.Л. Эльяш¹, Т.И. Полётова¹, О.А. Кычанова¹, А.А. Малышев¹, А.Н. Залялов¹, А.Г. Малькин¹, Р.Д. Даньков^{1,2}**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ²Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова
Расчетно-экспериментальные исследования по применению ускорителя субнаносекундного при измерении импульсных характеристик детекторов
- С79 Е.В. Мухин, С.А. Яковлев, Д.А. Фадеев**
ООО «НПП «Детектор»
Сравнение показателей чувствительности к воздействию ТЗЧ синтезаторов частот разных партий

- С80 М.В. Попов, Н.Ю. Шульга, А.И. Яньков, С.А. Яковлев**
ООО «НПП «Детектор»
Сравнительные испытания цифровых изоляторов сигнала ф.Texas instruments, на стойкость к воздействию одиночных заряженных частиц
- С81 А.А. Дедюхин, К.О. Максимов, М.В. Ткачук, М.Ю. Цыгвинцев**
ООО «ИРЗ ТЕСТ»
Особенности деградации токов утечки и пороговых уровней МОП-транзисторов при облучении ТЗЧ
- С82 П.Я. Кундышев^{1,2}, В.И. Бутин^{1,2}**
¹ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ²НИЯУ МИФИ
Влияние воздействия поляризованного микроволнового излучения на проникновение электромагнитного поля внутрь экранирующего корпуса
- С83 И.В. Бутин, В.И. Бутин**
ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
Процедура применения полупроводниковых детекторов для оперативной дозиметрии в полях реакторного излучения и результаты исследования устойчивости их калибровочных характеристик
- С84 А.А. Чибизов**
МОКБ «Марс» - филиал ФГУП «ВНИИА»
Подходы к построению бортовой системы управления на основе параллельной локальной вычислительной сети
- С85 Г.М. Блохин**
МОКБ «Марс» - филиал ФГУП «ВНИИА»
Отказоустойчивое оперативное запоминающее устройство на основе диагностической кэш-памяти малого объема
- С86 А.Е. Козюков**
ООО «Прогноз-РС»
Особенности проведения оценки радиационной стойкости расчетно-аналитическим методом
- С87 П.А. Александров, В.Н. Беклемишев, А.В. Беклемишева, М.Е. Потылицын, К.Н. Орлова**
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Разработка покрытий SiC химическим осаждением из газовой фазы для создания оптоэлектроники с повышенной радиационной стойкостью

Участники конференции «Стойкость-2026»

Ф.И.О.	Должность	Место работы
1. Алиев Руслан Теймурович	Ведущий научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино
2. Амельченко Артур Вадимович	Инженер 1 категории	АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» г. Москва
3. Амерканов Дмитрий Александрович	Заместитель заведующего отделом	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ г. Гатчина
4. Андреев Денис Александрович	Инженер-исследователь 1 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
5. Аникин Андрей Александрович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
6. Анохин Михаил Всеволодович	Начальник сектора	СКБ КП ИКИ РАН г. Таруса
7. Артёмов Михаил Евгеньевич	Ведущий инженер-конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки
8. Бакеренков Александр Сергеевич	Начальник отдела	АО «НИИ КП» г. Москва
9. Бакеренкова Диана Максимовна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
10. Балуев Арсений Андреевич	Инженер 1 категории	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
11. Батаева Мария Анатольевна	Научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
12. Белова Мая Павловна	Ведущий инженер-испытатель	ООО «Бюро 1440» г. Москва
13. Белоусов Сергей Викторович	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
14. Бердо Матвей Сергеевич	Техник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
15. Берлянд Александр Владимирович	Начальник лаборатории	ФГУП «ВНИИФТРИ» г. Солнечногорск
16. Бесецкий Алексей Валерьевич	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
17. Бибикова Вероника Валентиновна	Начальник группы	Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю.Е. Седакова г. Нижний Новгород
18. Бобровский Дмитрий Владимирович	Ведущий научный сотрудник, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
19. Богданова Полина Владимировна	Инженер 2 категории	АО «НИИ «Вектор» г. Санкт-Петербург
20. Боголюбова Полина Владимировна	Инженер климатико- механического комплекса	АО «НИИП» г. Лыткарино

21.	Бойко Никита Дмитриевич	Инженер	ПАО «РКК «Энергия» г. Королёв
22.	Боруздина Анна Борисовна	Заместитель технического директора / Заместитель руководителя ИЛ	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
23.	Бусыгина Ирина Алексеевна	Начальник отдела метрологии ионизирующих излучений	АО «НИИП» г. Лыткарино
24.	Бутин Валентин Иванович	Начальник отделения, д.т.н.	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
25.	Васильев Евгений Андреевич	Инженер	ИКИ РАН г. Москва
26.	Васильев Максим Юрьевич	Начальник сектора	АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» г. Жуковский
27.	Ватуев Александр Сергеевич	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
28.	Власенков Евгений Викторович	Ведущий конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки
29.	Вовк Оксана Валерьевна	Патентовед 1 категории	МОКБ «Марс» - филиал ФГУП «ВНИИА» г. Москва
30.	Гагарин Сергей Витальевич	Ведущий инженер	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
31.	Галевко Ольга Игоревна	Инженер-исследователь 2 категории	АО «НИИ КП» г. Москва
32.	Галкина Инна Александровна	Главный специалист	АО «НПЦАП» г. Москва
33.	Гвоздев Иван Сергеевич	Инженер по радиационной стойкости КА	АО «ЦНИИмаш» г. Королёв
34.	Гильванов Павел Ринатович	Владелец продукта	ООО «Прогноз-РС» г. Москва
35.	Горев Алексей Куркенович	Инженер-технолог	АО «НИИП» г. Лыткарино
36.	Горелов Андрей Александрович	Заместитель начальника отдела	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
37.	Губаревич Леонид Игоревич	Ведущий инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
38.	Деревянко Денис Юрьевич	Инженер-конструктор 1 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
39.	Дианков Сергей Юрьевич	Начальник лаборатории	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
40.	Дрижанов Алексей Васильевич	Начальник отдела	АО «НПЦАП» г. Москва
41.	Егоров Андрей Николаевич	Ведущий научный сотрудник	НИЯУ МИФИ АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
42.	Емельянов Владимир Владимирович	Главный научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино
43.	Епифанцев Константин Алексеевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

44.	Жаворонков Иван Леонардович	Ведущий инженер-программист 3 класса	ПАО «РКК «Энергия» г. Королёв
45.	Желавский Михаил Александрович	Ведущий инженер-разработчик	АО «НИИП» г. Лыткарино
46.	Жидков Никита Михайлович	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
47.	Заворотнов Дмитрий Владимирович	Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
48.	Задорожко Дарья Николаевна	Специалист	АО «НИИ КП» г. Москва
49.	Зебрев Геннадий Иванович	Профессор, д.т.н.	НИЯУ МИФИ г. Москва
50.	Земцов Артём Эдуардович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
51.	Зинченко Владимир Фёдорович	Главный научный сотрудник	АО «Российские космические системы» г. Москва
52.	Иванова Наталья Викторовна	Техник 1 категории	АО «НИИП» г. Лыткарино
53.	Иващенко Дмитрий Михайлович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
54.	Игнатенко Михаил Александрович	Инженер-конструктор 2 категории	АО «ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург
55.	Игнатьева Алина Евгеньевна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
56.	Кабальнов Юрий Аркадьевич	Ведущий научный сотрудник	Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю.Е. Седакова г. Нижний Новгород
57.	Калашников Владислав Дмитриевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
58.	Калашникова Анастасия Андреевна	Инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
59.	Калашникова Мария Олеговна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
60.	Кандрунин Владимир Евгеньевич	Главный специалист по ЭКБ	АО «НПК «СПП» г. Москва
61.	Карпухин Владимир Михайлович	Ведущий инженер	АО «ПНИЭИ» г. Пенза
62.	Кириллов Алексей Владимирович	Главный инженер – первый заместитель генерального директора	АО «НИИП» г. Лыткарино
63.	Кириллов Дмитрий Владиславович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
64.	Клюшкина Валерия Павловна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
65.	Козюков Александр Евгеньевич	Генеральный директор / Заместитель технического директора	ООО «Прогноз-РС» / АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
66.	Кольцов Кирилл Алексеевич	Инженер	ФГУП «ВНИИФТРИ» г. Солнечногорск

67.	Комбаев Тимур Шижурович	Ведущий конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки
68.	Коновалова Екатерина Дмитриевна	Инженер 1 категории	АО «Корпорация «ВНИИЭМ» г. Москва
69.	Кононенко Александр Иванович	Начальник управления диагностики и испытаний электротехнических элементов АС и ЯУ	АО «НИИП» г. Лыткарино
70.	Копылов Валерий Андреевич	Заместитель начальника отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
71.	Коротенко Владимир Алексеевич	Старший научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
72.	Костюченко Денис Сергеевич	Инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
73.	Котова Дарья Витальевна	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
74.	Кривдунова Софья Сергеевна	Инженер	ФГУП «ЦНИИХМ» г. Москва
75.	Кузьмин Иван Олегович	Ведущий инженер	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
76.	Кундышев Павел Ярославович	Начальник научно- исследовательского отдела	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
77.	Лебедев Александр Николаевич	Ведущий инженер	АО «СКТБ ЭС» г. Воронеж
78.	Литвинова Мария Владимировна	Техник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
79.	Лойко Юрий Сергеевич	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
80.	Лоскутов Илья Олегович	Ведущий инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
81.	Луконин Станислав Евгеньевич	Заведующий лаборатории	НИ ТПУ г. Томск
82.	Лысов Павел Сергеевич	Инженер-исследователь 2 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
83.	Маврицкий Олег Борисович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / НИЯУ МИФИ г. Москва
84.	Макаров Владимир Николаевич	Заместитель главного инженера	АО «ВНИИРТ» г. Москва
85.	Максименко Андрей Анатольевич	Начальник бюро	АО «НПК «СПП» г. Москва
86.	Мальцева Мария Сергеевна	Ведущий инженер- исследователь	АО «НИИ КП» г. Москва
87.	Марфин Владимир Александрович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
88.	Махиня Алексей Николаевич	Руководитель направления	АО «НИИП» г. Лыткарино

89.	Медведев Сергей Петрович	Инженер-конструктор 1 категории	АО «Туполев» г. Москва
90.	Мельник Екатерина Максимовна	Инженер 3 категории	АО «НИИ КП» г. Москва
91.	Метревели Алексей Александрович	Инженер-исследователь	ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
92.	Мещуров Олег Викторович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
93.	Михалева Любовь Николаевна	Ведущий инженер	ПАО «НПО «Алмаз» г. Москва
94.	Минзарипов Станислав Рафаэлевич	Инженер 2 категории	АО «СНИИП» г. Москва
95.	Мионов Иван Алексеевич	Инженер по расчету радиационной стойкости	ООО «Бюро 1440» г. Москва
96.	Морозов Владимир Юрьевич	Начальник отдела НИОКР	АО «НИИП» г. Лыткарино
97.	Мрозовская Елизавета Владимировна	Младший научный сотрудник	ИКИ РАН г. Москва
98.	Мурзин Вадим Юрьевич	Начальник сектора	АО «Российские космические системы» г. Москва
99.	Мусалитин Александр Александрович	Старший научный сотрудник	АО «Корпорация «ВНИИЭМ» г. Москва
100.	Мухин Евгений Вячеславович	Инженер-испытатель	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
101.	Некрасова Екатерина Николаевна	Начальник группы радиационных испытаний	ООО «НПЦ «Гранат» г. Санкт-Петербург
102.	Никоноров Виталий Валериевич	Инженер 1 категории	АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербург
103.	Новикова Алёна Александровна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
104.	Озеров Александр Иванович	Заместитель генерального директора по перспективным проектам	АО «НИИП» г. Лыткарино
105.	Паймин Антон Павлович	Инженер-разработчик РЭА	ООО «Бюро 1440» г. Москва
106.	Пермяков Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела	АО «ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург
107.	Першина Евгения Олеговна	Главный специалист по радиационной стойкости	ООО «Бюро 1440» г. Москва
108.	Петров Александр Сергеевич	Начальник отдела, к.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
109.	Петров Андрей Григорьевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
110.	Петров Михаил Сергеевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
111.	Печенкин Александр Александрович	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

112. Пилипенко Анатолий Сергеевич	Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» г. Снежинск
113. Плишко Роман Станиславович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
114. Полевич Станислав Анатольевич	Ведущий инженер	АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино
115. Попов Михаил Васильевич	Инженер-испытатель	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
116. Посысаев Евгений Иванович	Старший научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
117. Протопопов Григорий Александрович	Ведущий научный сотрудник	АО «ЦНИИмаш» г. Королев
118. Разаев Виталий Алексеевич	Главный специалист	МОКБ «Марс» - филиал ФГУП «ВНИИА»
119. Рахимова Виктория Амировна	Инженер-физик	АО «НИИП» г. Лыткарино
120. Ревин Сергей Юрьевич	Начальник отдела	АО «РПКБ» г. Раменское МО
121. Рубанов Павел Владимирович	Начальник управления радиационных испытаний-испытательного центра	АО «НИИП» г. Лыткарино
122. Руднев Михаил Михайлович	Начальник сектора	ПАО «РКК «Энергия» г. Королёв
123. Савинов Денис Юрьевич	Начальник установки УИН-10	АО «НИИП» г. Лыткарино
124. Сапожник Андрей Михайлович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
125. Сапожников Вячеслав Анатольевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
126. Сафьянов Алексей Анатольевич	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
127. Сахарова Людмила Юрьевна	Начальник группы	АО «Российские космические системы» г. Москва
128. Сиделев Алексей Владимирович	Начальник управления научных исследований и инновационных разработок	АО «НИИП» г. Лыткарино
129. Селихов Денис Олегович	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
130. Скоробогатов Михаил Анатольевич	Начальник отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
131. Слабоус Роман Владимирович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
132. Смирнов Максим Андреевич	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
133. Согоян Армен Вагоевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
134. Стародубцов Георгий Владимирович	Инженер-радиоэлектронщик 2 категории	АО «НИИ КП» г. Москва

135. Таперо Константин Иванович	Заместитель генерального директора по науке и инновациям, д.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
136. Тверитнева Олеся Алексеевна	Инженер-исследователь 3 категории	АО «НИИ КП» г. Москва
137. Тимошкин Максим Константинович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
138. Тужикова Ирина Алексеевна	Начальник отдела	АО «НИИ КП» г. Москва
139. Тулисов Евгений Викторович	Ведущий инженер установки ЛИУ-10	АО «НИИП» г. Лыткарино
140. Турбин Денис Сергеевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
141. Тюрников Максим Александрович	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
142. Уланова Анастасия Владиславовна	Заместитель генерального директора, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
143. Усачев Николай Александрович	Директор дизайн-центра	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
144. Усеинов Рустэм Галеевич	Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
145. Фёдоров Евгений Михайлович	Главный технолог	ООО «Бюро 1440» г. Москва
146. Фелицын Владислав Александрович	Ведущий инженер- исследователь	АО «НИИ КП» г. Москва
147. Филатов Сергей Анатольевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
148. Филимонов Александр Владимирович	Руководитель направления	АО «НИИП» г. Лыткарино
149. Фролова Александра Андреевна	Начальник отделения	АО «НИИ КП» г. Москва
150. Холина Марта Сергеевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
151. Худякова Наталья Александровна	Ведущий инженер	ООО НПП «НТТ» г. Санкт-Петербург
152. Цыгвинцев Михаил Юрьевич	Инженер-конструктор	ООО «ИРЗ ТЕСТ» г. Ижевск
153. Чубруков Фёдор Владимирович	Заместитель начальника	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
154. Чубунов Павел Александрович	Заместитель директора НТЦ-1	АО «НИИ КП» г. Москва
155. Чуков Георгий Викторович	Директор центра проведения испытаний	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
156. Чумаков Александр Иннокентьевич	Заместитель директора / Главный эксперт	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
157. Шамшурин Роман Вячеславович	Ведущий разработчик	ООО «Бюро 1440» г. Москва

158.	Шарапов Артём Алексеевич	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
159.	Шаталов Сергей Андреевич	Инженер 1 категории	ПАО «НПО «Алмаз» г. Москва
160.	Швецов-Шиловский Иван Иванович	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
161.	Шемонаев Александр Николаевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
162.	Шмаков Сергей Борисович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
163.	Шульгин Михаил Андреевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
164.	Щепанов Андрей Николаевич	Первый заместитель генерального директора по коммерции и программам развития	АО «НИИП» г. Лыткарино
165.	Эльяш Света Львовна	Ведущий научный сотрудник	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров
166.	Юдин Владислав Владимирович	Инженер-программист 3 категории	АО «НИИ КП» г. Москва
167.	Юрков Никита Владимирович	Инженер-физик	АО «НИИП» г. Лыткарино
168.	Яковлев Александр Сергеевич	Инженер-конструктор 3 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
169.	Яковлев Сергей Александрович	Заместитель руководителя ИЦ по спецфакторам	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
170.	Яненко Андрей Викторович	Ведущий научный сотрудник, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

